2 0 - P 6

A NEW-TYPE PHOTOCATHODE FOR POLARIZED ELECTRON SOURCE WITH DISTRIBUTED BRAGG REFLECTOR

Mitsuru TSUBATA,Tsutomu NAKANISHI,Shoji OKUMI,Chikako TAKAHASHI,Yasunori TANIMOTO, Masafumi TAWADA,Kazuaki TOGAWA,Hideki AOYAGI,Shinsuke NAKAMURA Department of Physics, Nagoya University,Nagoya 464,Japan Takashi SAKA,Toshihiro KATO New Materials Research Laboratory,Daido Steel Co.2–30,Daido-cho,Minami-ku,Nagoya 457,Japan Katsumi KISHINO Department of Electrical & Electronics Engineering,Sophia University, Chiyoda-ku,Tokyo 102,Japan Hiromichi HORINAKA College of Engineering,University of Osaka Perfecture, Sakai 593,Japan ABSTRACT

In order to increase the quantum efficiency of the strained GaAs photocathode for the highly polarized electron source, we designed a new type photocathode with a distributed Bragg reflector(DBR). A Fabry-Perot cavity is formed by the DBR and the GaAs surface. The large enhancement of quantum efficiency was observed at the laser wavelength which satisfied the condition for the resonant absorption of incident laser light. From this experiment, it becomes promising to make the photocathode which has the quantum efficiency more than ~1% together with the electron spin polarization higher than 80%.

ブラッグ反射鏡を用いた高性能偏極電子源

偏極電子ビームは磁場でビームの軌 道を曲げることがほとんど無い線形加 速器での使用に適している。高エネル ギー実験における偏極電子源の利用は 1970年代後半のスタンフォード線形加 速器センター(SLAC)での中性弱相互 作用におけるパリティの破れの確認が 最初であった。最近ではSLCにおける Z_{\circ} ボソン生成断面積左右非対称度測定 によるWeinberg-angle精密測定に使用 された。

現在SLCはじめ高エネルギー加速器 に用いられている偏極電子源はすべて GaAs型偏極電子源である。GaAs半導体 からの偏極電子の引き出しは1975年に Zürich工科大学で世界で最初に成功し、 その後高エネルギーから物性にいたる 広い分野での実験に応用されるように なった。

ところがGaAsをフォトカソードとして使用した場合、電子のスピン偏極度が原理的に最大でも50%に抑えられてしまうという弱点があった。GaAs型偏極電子源が実用化されて以来、50%の

壁を破るフォトカソードの開発が続け られてきた。

1991年に我々名古屋グループが開発 した「歪ませたGaAs(最大偏極度86%)」 ^{1,2)}、KEK-名古屋-NECグループが開 発した「A1GaAs-GaAs超格子(最大偏極 度72%)」³⁾、SLACグループが開発し た「歪ませたInGaAs(最大偏極度72%)」 の3種類のフォトカソードによってこ の壁が破られた。特に名古屋グループ の開発した「歪ませたGaAs」は偏極度 が高く、既にSLACでの実験に実用化さ れるなど新しい標準カソードになりつ つある。

しかし「歪ませたGaAs」は歪みの緩和を防ぐために、薄くしなくてはならず、かつ光の吸収率が普通のGaAsと比べて悪いので、どうしても量子効率が低くなってしまう。バルクGaAsの量子効率が3~10%あるのに対し、「歪ませたGaAs」では偏極度が最も高くなる波長で0.1~0.3%である。

「量子効率の低さはレーザーのパワ ーを上げて補えば良い」というのは簡 便であるが、レーザーのパワー密度を 上げるとNEA表面の寿命劣化が予想 されそう単純なものでもない。また Japan Linear Colliderへの応用のよう にマルチバンチ(55~90)で高いピー ク電流(1.5×10¹⁰/バンチ)の偏極電子 ビームを、比較的高いくり返し(50~ 150Hz) でしかもバンチ毎のビーム強度 のふらつきを1%以内に抑えて生成す ることを求められるような場合、 これ に対応できるレーザーを開発すること は容易ではないと言われている。必要 なレーザー光の出力を小さく抑えられ れば光源の開発にかかる負担を軽減で きることは明らかである。

G a A s から偏極電子を得る過程は (1)固体であるGaAsに円偏光レーザ ーを照射すると、価電子帯の電子が光 子を吸収して、伝導帯に偏極した電子 が励起される。

(2) 伝導帯電子が結晶内部から表面 まで移動する。

(3)結晶表面から真空中へ電子が飛び出す。

という3つのプロセスで構成され、量 子効率はこれら3つのプロセスの確率 の積として与えられる。



図-1 Strained GaAs フォトカソードの原理

これまで量子効率を上げる試みは、 (3)の表面をクリーンにし、結晶か ら真空へ飛び出してくる確率を上げる ことのみが強調されていたが、我々は 新しい観点として(1)の今まで無駄 に透過させていたレーザー光を再利用 することを考えた。原理は図2のよう に多層ブラッグ反射鏡(DBR)を用いて 透過光を反射させるものである。 表面のGaAsと真空との境界は両者の 屈折率の差から反射率~30%の鏡とし て働く。ブラッグ反射鏡と表面の2つ の平行反射鏡の間に光の吸収体を挟む 構造になっており、光学ではFabry-Pe rot cavityと呼ばれているものである。 2 つの鏡の間光空的距離が「往復の 光路長が入射光の波起こり、鏡の間に あるGaAsに吸収される電子の数が増え ることになる。



図-2 Bragg 反射鏡を付けたフォトカソード の構造と動作を示す概念図

大事なポイントはもとの入射光によ って励起された電子のスピンと、ブラ ッグ反射鏡および表面で反射された光 によって励起された電子のスピンとが 一致することである。 そうでないと量 子効率は上がっても偏極度が下がって しまう。円偏光は反射される毎にその ヘリシティを変えるが、電子が真空へ 飛び出していく表面の方向に対して、 量子化軸も変わる(光の進行方向が変 わる)ので、2つの変化がキャンセル して励起された電子のスピンの向きは 結果的に同じになるからである。 なお、この手法は「歪ませたGaAs」 にとどまらず、「超格子」等の他のフ ォトカソードにも応用可能である。 作成した試料の反射スペクトルを図 3に示す。また~3 φのレーザー光を 用いて実測した量子効率を図4に示す。 量子効率に現れた3つの顕著な山は反 射スペクトルの谷の部分と一致し、こ こで強い共鳴吸収が起こったことを証

明している。



- カソード
- 白丸(〇):Bragg 反射鏡無しのフォト カソード 実線(ー):シミュレーション計算によ るエンハンス因子

実測した偏極度のスペクトルを図5 に示す。全体的に波長が~10nmシフト しているが、最大偏極度は~80%でD BRによる減偏極が無いことが確認で きた。シフトの原因は、今回の試料の GaAsP層のリンの混晶比が設計では17% であったが実際には12%になってしま って表面のGaAs層の歪みが設計より小 さくなってしまったからである。



図-5 電子スピン偏極度スペクトル
黒丸(●): Bragg 反射鏡付きのフォト
カソード
白丸(○): Bragg 反射鏡無しのフォト
カソード

この試料によりエンハンスのピーク で量子効率~1.3%の従来の約10倍とい う良好な結果が得られ、我々が開発し た「ブラッグ反射鏡付きフォトカソー ド」の有効性が証明された。この結果 は既に論文にまとめてある⁴⁾。共鳴吸 収による量子効率のピークの波長と偏 極度のピークの波長を一致させ偏極度 の向上を狙った試料を現在テストして いる。

- T. Nakanishi et al. Phys. Lett. A518(1991) 345-349
- 2) H. Aoyagi et al. Phys. Lett. A167(1992) 415-420
- 3) T.Omori et al. Phys.Rev.Lett. 67(1991) 3294-3297
- 4) T. Saka et al. Japan. Jour. Appl. Phys. vol. 32 (1993) 1837-1840